

372xx-1□E0-00□ PL

## ミニ・クランプ

## ボードマウントソケット

## ライトアングル表面実装型

- ソルダータブによる基板への確実な保持
- ボディ底面に配置したソルダータブにより、実装面積を削減。
- 業界標準 **e-con** 準拠コネクタ 注1
- 感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置



## RoHS Compliant

[材料及び処理]	■部品名	■材料及び処理	■備考
	ボディ	LCP	UL94V-0 黒色
	コンタクト	銅合金	接続部 : ニッケルメッキ下地、金メッキ0.2μm以上 テール部 : ニッケルメッキ下地、金フラッシュメッキ
[適合対象]	■コネクタ	ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 371xx-xxxx-x00 FL	
	■基板	推奨基板パターン図参照	
[定 格]	■項目	■規格	
	電圧	AC/DC 32V以下	
	電流	最大3.0A	
	使用温度範囲	-20~85°C(1A通電時)/-20~75°C(2A通電時)/-20~60°C(3A通電時)、※結露・水滴無きこと	
[単体特性]	■項目	■規格	■条件
	半田付け性	ゼロクロスタイム:3秒以下	Sn-3Ag-0.5Cu半田使用、メニスコグラフ法245°C
	半田耐熱性	試験後、外観に著しい変形なきこと	リフロー : プリヒート150~180°C、90~120秒 半田付け220°C以上、30~60秒 ただし、ピーク温度は240~250°C、10秒未満 手半田 : 390°C、3秒、2回まで
[物理的特性]	■項目	■規格	■条件
	挿抜力(初期状態)	挿入力:2.0N/pin以下 抜去力:0.1N/pin以上	弊社適合コネクタとの組合せによる。挿抜スピード5mm/分で測定。規格は単極あたりの算出値。
	ラッチ保持力	58.8N以上(垂直方向)	25mm/分で測定。
	挿抜耐久性	試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。	挿抜500回
	耐振動性	試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下。	振動試験時に瞬断を測定する。(表1参照)
	耐衝撃性	試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下。	490m/s <sup>2</sup> 、11m秒、正弦半波、X・Y・Z方向 各3回。
[電気的特性]	■項目	■規格	■条件
	耐電圧	漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと。	隣接コンタクト間にAC1000VRMSを1分間印加。
	絶縁抵抗	1000MΩ以上	隣接コンタクト間にDC600V印加し1分後、測定する。
	瞬断	試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと。	振動試験は3Mシーケンス2として実施。
	接触抵抗	初期接触抵抗20mΩ以下 各環境試験後の接触抵抗増加値が25mΩ以下のこと。	抵抗測定電流1mA、開放電圧20mVの4端子法にて測定する。(弊社適合コネクタとの組合せ時であり、コンタクトのバルク抵抗を含む。) ●3Mシーケンス 1/50回挿抜→耐湿試験→塩水噴霧試験 ●3Mシーケンス 2/熱衝撃試験→湿度試験→振動試験 ●3Mシーケンス 3/高温寿命試験 ●H <sub>2</sub> Sガスシーケンス/50回挿抜→H <sub>2</sub> Sガス試験 ●耐久挿抜試験/500回挿抜 * 各種環境試験条件は表1参照

表1

■試験項目	■試験条件
耐湿試験	-10~65°C、95%RH/10サイクル
塩水噴霧試験	塩化ナトリウム5%溶液、35°C/48時間
熱衝撃試験	-55°C→25°C→85°C→25°C/5サイクル
湿度試験(定常状態)	40°C、95%RH/96時間
高温寿命試験	85°C 1A通電/1000時間
H <sub>2</sub> Sガス試験	濃度3±1ppm、40°C、70~80%RH/96時間
振動試験	10→55Hz、振幅1.52mm又は10G、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間
衝撃試験	490m/s <sup>2</sup> 、11m秒、正弦半波/X・Y・Z方向各3回

注1) **e-con** (Easy & Economy Connector): 主要なコントローラメーカー、センサーメーカーおよびコネクタメーカーでセンサーコネクタの標準化を検討・推進しています。その目的は従来のセンサーコネクタの諸課題を解決することにあります。